

# Predstavljanje Pretražnog elektronskog mikroskopa (FEG-SEM) i Transmisijskog elektronskog mikroskopa (TEM)

Zgrada tri fakulteta, Ruđera Boškovića 33, dvorana amfiteatar A0-1

**Srijeda, 26.10.**

9:30 - 10:00	Registracija
10:00 - 10:05	<b>Uvodna riječ</b>
10:05 - 10:25	<b>JEOL company, JEOL's range of products</b> govornik: Nicolas Ravier, JEOL SAS, prodajni menadžer
10:25 - 10:45	<b>JSM 7610F Plus, Cross section Polisher and other SEMs from JEOL</b> govornik: Yusuke Uetake, JEOL SAS, stručnjak za primjenu
10:45 - 11:05	<b>JEM 1400 Flash and other TEMs from JEOL</b> govornik: Dr. Regis Ravelle Chapuis, JEOL SAS, stručnjak za primjenu
11:05 - 11:20	<b>Korisničko iskustvo s JSM 7610FPlus</b> govornik: prof.dr.sc. Ante Bilušić, PMFST
11:20 - 11:40	<b>Korisničko iskustvo s JEM 1400Flash</b> govornik: prof.dr.sc. Ivana Bočina, PMFST
11:40 - 12:10	<b>Posjet laboratorijima TEM-a i FEG-SEM-a</b>
12:10 - 14:00	<b>Zakuska</b>
14:00 - 17:00	Napredni trening na JSM 7610FPlus i JEM 1400Flash (potrebna prethodna prijava)

**Četvrtak, 27.10.**

10:00 - 13:00	Napredni trening na JSM 7610FPlus i JEM 400Flash (potrebna prethodna prijava)
14:30 - 16:30	Q&A i trening (potrebna prethodna prijava)